Теми рефератів

1. Состояние и тенденции развития европейской нанотехнологии.

2. Измерительные и калибровочные возможности средств измерений нанометрового диапазона.

3. Классификация тест-объектов для калибровки растровых электронных микроскопов в нанометровом диапазоне.

4. Самоорганизация и самосборки для практической реализации нанотехнологий.

5. Проблемы метрологического обеспечения измерения параметров наночастиц в технологических средах.

6. Методы и средства сертификационных испытаний оптических аналитических приборов.

7. Геометрия формирования изображения в сканирующей зондовой микроскопии.

8. Технические измерения, взаимозаменяемость и нанометрология.